



Title of Change:	Qualification of Silan (Hangzhou, China) Wafer FAB for Bipolar Products	
Proposed First Ship date:	25 May 2019	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or: - for FG products contact Seok-Ho.Choi@onsemi.com - for FP products contact Daniel.Jeon@onsemi.com Please see parts list section below	
Samples:	<i>Samples will be available after completion of qualification.</i> Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.Samples@onsemi.com > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Change Part Identification:	The label listed on the box and reel will contain the CS (Custom Source)/DIFFUSED IN for the wafer FAB location. CS/ DIFFUSED IN = CN will be from Silan, China, CS/DIFFUSED IN = KR will be from Bucheon, Korea. Material from (2) different wafer FABs cannot be combined onto (1) reel per internal specifications. Please see sample label on Page 2 at the following URL: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the Custom Source/ DIFFUSED IN Reference.	
Change Category:	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd
Description and Purpose:		
ON Semiconductor would like to inform our customers about our intent to qualify our Bipolar technology products at the Silan (Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd) FAB in Hangzhou, China. This qualification will enable expanded capacity for this technology. Once qualification is complete and at the expiration of the FPCN, all products listed here will be dual sourced from its current ON Semiconductor wafer fab in Bucheon, Korea or Silan, China. FPCN's will be submitted in phases as different products are qualified.		
	Before Change Description	After Change Description
FAB Location	Bucheon, Korea	Silan, China or Bucheon, Korea
Wafers produced in Silan are 5" while wafers produced in Bucheon are 6". This is a continuation to previous qualifications already performed transferring other Bipolar products from Bucheon to Silan. There is no product marking change as a result of this change.		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: FSBB30CH60C-F166

PACKAGE: SPM27

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, Vcc=20V, 480V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, Vcc=20V, Vpn=40V	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

QV DEVICE NAM: FPAB30BH60B

PACKAGE : SPM27

Test	Specification	Condition	Interval
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc

QV DEVICE NAME: KA5L0380RYDTU

PACKAGE: TO220

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=85°C, Vcc=22V, HV=800V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

QV DEVICE NAME: KA3525A

PACKAGE: PDIP16

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 65°C, Vcc=40V	1008 hrs

QV DEVICE NAME: KA1H0165RTU

PACKAGE TO220

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=20V, HV=650V	1008 hrs

QV DEVICE NAME: FAN7527BMX

PACKAGE: SOIC8

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, Vcc=30V	1008 hrs



QV DEVICE NAME: KA7500CDTF

PACKAGE: SOICN16

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=42V	1008 hrs

QV DEVICE NAME: KA5M0165RN

PACKAGE PDIP8

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=22V, HV=650V	1008 hrs

QV DEVICE NAME: FS7M0880TU

PACKAGE TO3P5

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta= 60°C, Vcc=24V, HV=800V	1008 hrs

QV DEVICE NAME: KA7815ETU

PACKAGE TO-220

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % V=30V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, bias = 20V	1008 hrs

QV DEVICE NAME KA7915TU

PACKAGE TO-220

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % V=30V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, bias = 20V	1008 hrs

Estimated date for qualification completion: 15 January 2019

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom **(FP)** parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

(FG) Part Number	Qualification Vehicle
FS7M0880TU	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
FS7M0880YDTU	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
KA5M0165RN	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
KA5H0165RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0165RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0365RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0380RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5L0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5L0565RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0265RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0365RTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0365RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0380RTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
FAN7554	KA5L0380RYDTU
FAN7527BMX	FAN7527BMX/KA5L0380RYDTU
FAN7527BN	KA5L0380RYDTU
KA7500CDTF	KA7500CDTF/KA5L0380RYDTU
KA7500C	KA5L0380RYDTU
FAN8413MX_G	FAN7527BMX/KA5L0380RYDTU
KA1H0165RTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA1M0565RTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA1M0565RYDTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA3525A	KA3525A/KA7915TU
KA34063A	KA3525A/KA7915TU
KA7500B	KA3525A/KA7915TU
KA3883CDTF	KA3525A/KA7915TU
KA7552A	KA3525A/KA7915TU
KA7553A	KA3525A/KA7915TU



(FP) Part Number	Qualification Vehicle
FCBB20CH60SF	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPAB20BH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPAB30BH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPDB40PH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPDB60PH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB15CH60C	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB15CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB20CH60C	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CT	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CTSL	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB30CH60C	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C_F166	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60CT	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FCBS0550	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSAM50SM60A	KA7815ETU/FPAB30BH60B
FSAM75SM60A	KA7815ETU/FPAB30BH60B
FSAM75SM60SL	KA7815ETU/FPAB30BH60B

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22561X

発行日: 9 January 2019

変更件名:	バイポーラ製品のウェハーFABとして Silan (杭州市、中国)を認定							
初回出荷予定日:	25 May 2019							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または以下にお問い合わせください。 - FG 製品に関しては Seok-Ho.Choi@onsemi.com - FP 製品に関しては Daniel.Jeon@onsemi.com 以下の部品リストを参照ください							
サンプル:	サンプルの提供は認定完了後に開始されます。 現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > お問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。							
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > お問い合わせください。							
変更部品の識別:	ボックスおよびリール上にリストされたラベルにはウェハーFAB 拠点を示す CS(カスタマーソース)または DIFFUSED IN コードが記載されています。Silan (中国)品の CS/DIFFUSED IN コードは CN、ON Bucheon (韓国)品の CS/DIFFUSED IN コードは KR と表示されます。社内規定により両ウェハーFab 拠点の製品を 1 つのリールに混載することはありません。 CS/DIFFUSED IN コードの位置については以下の URL にある冊子の 2 ページ目のサンプルラベルをご参照ください。 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF							
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____							
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他 _____							
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: None	外部製造工場 / 下請業者拠点: Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd						
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは杭州市 (中国)にある Silan (Hangzhou Silan Integrated Circuit Co, Ltd) FAB をオンのバイポーラ製品の製造拠点として認定する意向であることをお知らせします。この認定により生産能力が拡大されます。</p> <p>認定が完了し最終通知 FPCN が実行された後は、全ての対象製品は既存のウェハー製造拠点である ON Bucheon (韓国)と Silan (中国)とのデュアルソース品となります。最終通知 FPCN は Silan 品の認定が完了した段階で発行されます。</p> <table border="1" data-bbox="126 1717 1511 1812"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAB の場所</td> <td>ON Bucheon (韓国)</td> <td>Silan (中国)または ON Bucheon (韓国)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ON Bucheon FAB のウェハーサイズは 6 インチですが、Silan FAB のウェハーサイズは 5 インチとなります。また、本件は他のバイポーラ製品で既に実施された Bucheon から Silan への移管認定に続くものです。</p> <p>今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	FAB の場所	ON Bucheon (韓国)	Silan (中国)または ON Bucheon (韓国)
	変更前の表記	変更後の表記						
FAB の場所	ON Bucheon (韓国)	Silan (中国)または ON Bucheon (韓国)						



認定計画:

認定試験用ピークル: FSBB30CH60C-F166

PACKAGE: SPM27

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, Vcc=20V, 480V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, Vcc=20V, Vpn=40V	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs

認定試験用ピークル: FPAB30BH60B

PACKAGE : SPM27

テスト	仕様	条件	間隔
TC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cyc

認定試験用ピークル: KA5L0380RYDTU

PACKAGE: TO220

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=85°C, Vcc=22V, HV=800V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	

認定試験用ピークル: KA3525A

PACKAGE: PDIP16

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 65°C, Vcc=40V	1008 hrs

認定試験用ピークル: KA1H0165RTU

PACKAGE TO220

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=20V, HV=650V	1008 hrs

認定試験用ピークル: FAN7527BMX

PACKAGE: SOIC8

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C, Vcc=30V	1008 hrs



認定試験用ピークル: KA7500CDTF

PACKAGE: SOICN16

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=42V	1008 hrs

認定試験用ピークル: KA5M0165RN

PACKAGE PDIP8

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 85°C, Vcc=22V, HV=650V	1008 hrs

認定試験用ピークル: FS7M0880TU

PACKAGE TO3P5

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta= 60°C, Vcc=24V, HV=800V	1008 hrs

認定試験用ピークル: KA7815ETU

PACKAGE TO-220

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % V=30V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, bias = 20V	1008 hrs

認定試験用ピークル: KA7915TU

PACKAGE TO-220

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % V=30V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A110	85°C, 85% RH, bias = 20V	1008 hrs

認定完了予定日: 15 January 2019



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム (FP) 部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の添付資料、または [PCN カスタマイズポータル](#) に記載されています。

(FG) 部品番号	認定試験用ピークル
FS7M0880TU	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
FS7M0880YDTU	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
KA5M0165RN	FS7M0880TU/KA5L0380RYDTU
KA5H0165RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0165RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0365RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0380RTU	KA5L0380RYDTU
KA5H0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5L0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5L0565RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0265RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0365RTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0365RYDTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0380RTU	KA5L0380RYDTU
KA5M0380RYDTU	KA5L0380RYDTU
FAN7554	KA5L0380RYDTU
FAN7527BMX	FAN7527BMX/KA5L0380RYDTU
FAN7527BN	KA5L0380RYDTU
KA7500CDTF	KA7500CDTF/KA5L0380RYDTU
KA7500C	KA5L0380RYDTU
FAN8413MX_G	FAN7527BMX/KA5L0380RYDTU
KA1H0165RTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA1M0565RTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA1M0565RYDTU	KA1H0165RTU/KA7815ETU
KA3525A	KA3525A/KA7915TU
KA34063A	KA3525A/KA7915TU
KA7500B	KA3525A/KA7915TU
KA3883CDTF	KA3525A/KA7915TU
KA7552A	KA3525A/KA7915TU
KA7553A	KA3525A/KA7915TU



(FP) 部品番号	認定試験用ピークル
FCBB20CH60SF	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPAB20BH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPAB30BH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPDB40PH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FPDB60PH60B	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB15CH60C	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB15CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB20CH60C	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CT	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60CTSL	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB20CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSBB30CH60C	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60C_F166	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60CT	KA5L0380RYDTU/FSBB30CH60C-F166
FSBB30CH60F	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FCBS0550	KA5L0380RYDTU/FPAB30BH60B
FSAM50SM60A	KA7815ETU/FPAB30BH60B
FSAM75SM60A	KA7815ETU/FPAB30BH60B
FSAM75SM60SL	KA7815ETU/FPAB30BH60B